

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) | [Publications/Services](#) | [Standards](#) | [Conferences](#) | [Careers/Jobs](#)Welcome  
United States Patent and Trademark Office

&gt; At

[Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [IEEE Peer Review](#)**Quick Links****Welcome to IEEE Xplore®**

- Home
- What Can I Access?
- Log-out

**Tables of Contents**

- Journals & Magazines
- Conference Proceedings
- Standards

**Search**

- By Author
- Basic
- Advanced

**Member Services**

- Join IEEE
- Establish IEEE Web Account
- Access the IEEE Member Digital Library

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#) | [No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2004 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)**IEEE Xplore**  
RELEASE 1.5Welcome  
United States Patent and Trademark Office

&gt; At

[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)**Quick Links**

Welcome to IEEE Xplore®

- Home
- What Can I Access?
- Log-out

**Tables of Contents**

- Journals & Magazines
- Conference Proceedings
- Standards

**Search**

- By Author
- Basic
- Advanced

**Member Services**

- Join IEEE
- Establish IEEE Web Account
- Access the IEEE Member Digital Library

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#) | [No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2004 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#)   [Publications/Services](#)   [Standards](#)   [Conferences](#)   [Careers/Jobs](#)Welcome  
United States Patent and Trademark Office

» A

[Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [IEEE Peer Review](#)**Quick Links**

Welcome to IEEE Xplore®

- Home
- What Can I Access?
- Log-out

[Tables of Contents](#)

- Journals & Magazines
- Conference Proceedings
- Standards

[Search](#)

- By Author
- Basic
- Advanced

[Member Services](#)

- Join IEEE
- Establish IEEE Web Account
- Access the IEEE Member Digital Library

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#) | [No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2004 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) | [Publications/Services](#) | [Standards](#) | [Conferences](#) | [Careers/Jobs](#)Welcome  
United States Patent and Trademark Office

» Se

[Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [IEEE Peer Review](#)**Quick Links****Welcome to IEEE Xplore®**

- Home
- What Can I Access?
- Log-out

**Tables of Contents**

- Journals & Magazines
- Conference Proceedings
- Standards

**Search**

- By Author
- Basic
- Advanced

**Member Services**

- Join IEEE
- Establish IEEE Web Account
- Access the IEEE Member Digital Library

Your search matched **4** documents.

A maximum of **500** results are displayed, **15** to a page, sorted by **Relevance Descending** order.

**Results Key:****JNL** = Journal or Magazine   **CNF** = Conference   **STD** = Standard**1 Teleoperated system performance evaluation**

*McLean, G.F.; Prescott, B.; Podhorodeski, R.;*  
Systems, Man and Cybernetics, IEEE Transactions on , Volume: 24 , Issue: 5 1994  
Pages:796 - 804

[\[Abstract\]](#) | [\[PDF Full-Text \(1192KB\)\]](#) | **IEEE JNL****2 Making optimal design decisions for next generation dispensing too**

*Prescott, B.P.; LeBaron, T.;*  
Simulation Conference, 2003. Proceedings of the 2003 Winter , Volume: 2 , D 10, 2003  
Pages:1388 - 1393

[\[Abstract\]](#) | [\[PDF Full-Text \(563KB\)\]](#) | **IEEE CNF****3 Hierarchical clustering for automated line detection**

*McLean, G.; Prescott, B.; Kotturi, D.;*  
Communications, Computers and Signal Processing, 1993., IEEE Pacific Rim Conference on , Volume: 1 , 19-21 May 1993  
Pages:244 - 247 vol.1

[\[Abstract\]](#) | [\[PDF Full-Text \(316KB\)\]](#) | **IEEE CNF****4 Teleoperator task performance evaluation using 3-D video**

*McLean, G.F.; Prescott, B.;*  
Communications, Computers and Signal Processing, 1991., IEEE Pacific Rim Conference on , 9-10 May 1991  
Pages:615 - 618 vol.2

[\[Abstract\]](#) | [\[PDF Full-Text \(300KB\)\]](#) | **IEEE CNF**[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#) | [No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Feedback](#)

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)Welcome  
United States Patent and Trademark Office

&gt;&gt; See

[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)**Quick Links**[Welcome to IEEE Xplore®](#)

- [Home](#)
- [What Can I Access?](#)
- [Log-out](#)

[Tables of Contents](#)

- [Journals & Magazines](#)
- [Conference Proceedings](#)
- [Standards](#)

[Search](#)

- [By Author](#)
- [Basic](#)
- [Advanced](#)

[Member Services](#)

- [Join IEEE](#)
- [Establish IEEE Web Account](#)
- [Access the IEEE Member Digital Library](#)

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#) | [Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#) | [No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2004 IEEE — All rights reserved